

高速半導体全光ゲートを応用した高周波光パルス発生

上野 芳康

電気通信大学 電子工学専攻

e-mail: ueno@ee.uec.ac.jp

1 はじめに

モードロックとは異なる独自のメカニズムに基づく、10GHz~160GHzと高周波な光パルス発生、およびその高精度制御を目指し、研究を進めている。高速な半導体全光ゲートを応用した本研究の顕著な特徴、最近の研究成果、および今後の展望をご紹介します。

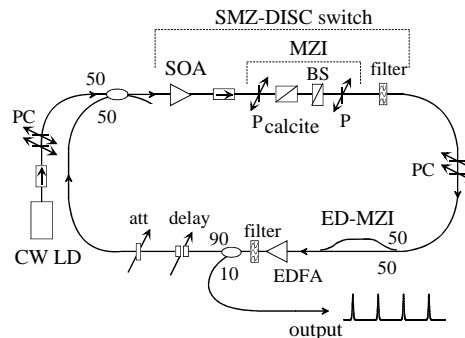


図1 DISC-Loop型光パルス発生器の構造^{2,3}

SMZ-DISC: 全光ゲート¹、SOA: 半導体光増幅器

2 DISC-Loop型パルス発生器

SMZ-DISC型半導体全光ゲート¹の出力を入力へ帰還してリング共振器を構成し、適切な帰還条件下で外部から連続光を注入すると、リング内部に高周波短パルスが発生する(図1)²。光パルス発生の主たる起源は、半導体のバンド充填屈折率変化である。これまで、半導体全光ゲートモデルに基づくパルス発生モデル²、および、概ねフーリエ変換限界な10GHz, 5psパルス発生実証³が報告されている。

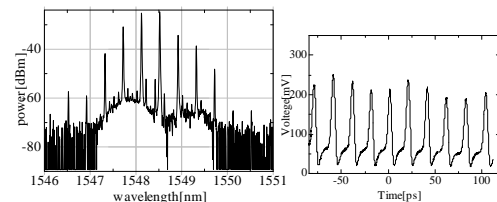


図2 SMZ-DISCゲート出力のスペクトルと相互相関波形
 ゲートを単独で駆動し、観測した光出力である。
 繰返し周波数= 50 GHz、ゲート窓幅= 5 ps。

3 研究目標と最近の成果

現在の研究目標は、複数のパルス発生条件要因ごとの原理解明と、より厳密な周波数精度決定要因の追求である。これらと並行し、より魅力的な40GHz~160GHz帯へ実験環境を移しつつある。図2に、最近の研究でDISCゲート部分を単独で光制御して観測した、50GHz光パルス出力のスペクトル(波長分解能=1.3GHz)と相互相関波形(時間分解能=2ps)の1例を示す。

本研究の特色は、出力光パルスの繰返し周波数、パルス幅、中心光周波数それぞれの決定要因が、非線形光学材料以外の不活性光学材料定数(または独立な外部光源)と期待されることである。光周波数: 繰返し周波数: リング固有周波数の相対比率が概ね $10^8:10^4:1$ と等間隔に並ぶことも、今後の高精度制御研究上の利点となろう。バンド充填効果に基づくDISCゲートの周波数限界は300GHz以上(ゲート幅限界 $<1ps$)⁴と当初予想以上に速く、ゲート制御光エネルギーは比較的小さく($\sim 100fJ/pulse$)^{1,4}、基礎研究にも通信応用研究にも魅力的な題材である。

参考文献

- ¹ Y. Ueno, S. Nakamura, and K. Tajima, Opt. Lett. **23** (1998) 1846.
- ² Y. Ueno, S. Nakamura, and K. Tajima, Jpn. J. Appl. Phys. **39** (2000) L803.
- ³ Y. Ueno, S. Nakamura, and K. Tajima, Appl. Phys. Lett. **79** (2001) 2520.
- ⁴ Y. Ueno, S. Nakamura, and K. Tajima, J. Opt. Soc. Am. **B19** (2002) 2573.